· ⑲ 日本国特許庁(JP)

10 特許出顧公告

❷特 許 公 報(B2)

平5-7659

®Int_C1.*

@発

四代 理 人

識別記号

庁内整理番号

2000公告 平成5年(1993)1月29日

G 01 P 5/10

H 8708-2F

願 昭58(1983)12月27日

発明の数 4 (全21頁)

❷発明の名称 流速センサ

判 平1-19410

创特 頤 昭58-244964

❷公 開 昭60-142268

@昭60(1985)7月27日

ロバート・ジー・ジョ

多出

アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスマーチサークル第 12814番地

ンソン ②印発 明 者 ロバート・イー・ヒガ

アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスサウスイースト第 8番ストリート第810番地 アパートメント20

⑫発 明 者 フイリツブ・ジエィ・ ボーレエ

アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリスアルドリッチアベ

山武ハネウエル株式会

東京都渋谷区渋谷2丁目12番19号

ニユーサウス第4456番地

の出 願 人 社

弁理士 松下 義治

審判の合議体 審判長 宮 本 昭男 審判官 奥村 寿一 審判官 上 原 89多考文献 特開 昭56-18381 (JP, A) 実開 昭50-61080 (JP, U)

1

切特許請求の範囲

1 結晶面(100)と結晶軸[110]を有し、か つ、最上表面に形成されてなる空気スペースを有 するシリコン半導体基板と、

含み、薄膜の絶縁層により包まれてなる薄膜部材 であつて、上記結晶面(100)に対してほぼ平行 となる平面上に配置されるとともに上記空気スペ ースに位置するように、少なくともその一端が上 記半導体基板に保持され、そのほとんど大部分が 10 この基板と非接触状態に配置される第1の薄膜部 材と、

一対の熱感知センサの他方と上記ヒータの残部 とを含み、薄膜の絶縁層により包まれてなる薄膜 部材であつて、上記結晶面(100)に対してほぼ 15 記半導体基板に保持され、そのほとんど大部分が 平行となる平面上に配置されるとともに上記空気 スペースに位置するように、少なくともその一端 が上記半導体基板に保持され、そのほとんど大部 膜部材と、

を具備するとともに、

2

上記一対の薄膜の熱感知センサは、上記ヒータ を挟んで位置して成ることを特徴とする流速セン サ。

- 2 薄膜の絶縁層は、窒化シリコンから成ること 一対の熱感知センサの一方とヒータの一部とを 5 を特徴とする特許請求の範囲第1項記載の流速セ ンサ。
 - 3 結晶面 (100) と結晶軸 (110) を有し、か つ、最上表面に形成されてなる空気スペースを有 するシリコン半導体基板と、
 - 一対の熱感知センサの一方とヒータの一部とを 含み、薄膜の絶縁層により包まれてなる薄膜部材 であつて、上記結晶面(100)に対してほぼ平行 となる平面上に配置されるとともに上記空気スペ ースに位置するように、少なくともその一端が上
 - この基板と非接触状態に配置される第1の薄膜部 材と、

一対の熱感知センサの他方と上記ヒータの残部 分がこの基板と非接触状態に配置される第2の薄とを含み、薄膜の絶縁層により包まれてなる薄膜 20 部材であつて、上記結晶面 (100) に対してほぼ 平行となる平面上に配置されるとともに上記空気

スペースに位置するように、少なくともその一端 が上記半導体基板に保持され、そのほとんど大部 分がこの基板と非接触状態に配置される第2の薄 膜部材と、

連結部材と、

を具備するとともに、

上記一対の薄膜の熱感知センサは、上記ヒータ を挟んで位置して成ることを特徴とする流速セン

- 4 薄膜の絶縁層は、窒化シリコンから成ること を特徴とする特許請求の範囲第3項記載の流速セ
- 5 結晶面 (100) と結晶軸 [110] を有し、か つ、最上表面に形成されてなる空気スペースを有 15 し、 するシリコン半導体基板と、

上記結晶面(100)に対してほぼ平行となる平 面上に配置されるとともに上記空気スペースに位 置するように、少なくともその一端が上記半導体 基板に保持され、そのほとんど大部分がこの基板 20 る流速センサ。 と非接触状態に配置される薄膜のヒータと、

上記結晶面(100)に対してほぼ平行となる平 面上に配置されるとともに上記空気スペースに位 置するように、少なくともその一端が上記半導体 と非接触状態に配置される一対の薄膜の熱感知セ ンサと、

上記半導体基板に設けられる周囲温度を検出す るための比較抵抗素子と、

ブリツジ回路を制御するための電子回路を具備

上記一対の薄膜の熱感知センサの各々は上記ヒ ータの対向する両側面に配置され、

上記ヒータは、上記電子回路により、周囲温度 35 より一定の高い温度で駆動されることを特徴とす る流速センサ。

6 結晶面 (100) と結晶軸 [110] を有し、か つ、最上表面に形成されてなる空気スペースを有 するシリコン半導体基板と、

薄膜の絶縁層により包まれて薄膜部材を形成 し、更に、上記結晶面 (100) に対してほぼ平行 となる平面上に配置されるとともに上記空気スペ ースに位置するように、上記薄膜部材の少なくと

も一端が上配半導体基板に保持され、そのほとん ど大部分がこの基板と非接触状態に配置される薄 腹のヒータと、

薄膜の絶縁層により包まれて薄膜部材を形成 上記第1および第2の薄膜部材同士を連結する 5 し、更に、上記結晶面(100)に対してほぼ平行 となる平面上に配置されるとともに上記空気スペ ースに位置するように、上記薄膜部材の少なくと も一端が上記半導体基板に保持され、そのほとん ど大部分がこの基板と非接触状態に配置される一 10 対の薄膜の熱感知センサと、

> 上記半導体基板に設けられる周囲温度を検出す るための比較抵抗素子と、

> この比較抵抗素子と上記薄膜のヒータとを含む ブリツジ回路を制御するための電子回路を具備

上記一対の薄膜の熱感知センサの各々は上記と ータの対向する両側面に配置され、

上記ヒータは、上記電子回路により、周囲温度 より一定の高い温度で駆動されることを特徴とす

発明の詳細な説明

本発明は空気の流れ速度を測定する流速センサ に関する。市販されている空気の流れの中にそう 入する長いプローブの先に、1本の熱線かサーミ 基板に保持され、そのほとんど大部分がこの基板 25 スタを配置するものである。これは、空気の流れ による冷却効果によつて引き起される温度低下 と、それにともなう電気抵抗値の変化により空気 の流れ速度を測定するものである。こういうデバ イス構成であるからセンサエレメントは空気の流 この比較抵抗素子と上記薄膜のヒータとを含む 30 れにさらされるので、破損や汚れを受け易いので ある。しかもこの空冷による温度変化は全く直線 性がないたへ、得られる電気信号を電子回路によ り、リニアライズすることが必要となる。さらに これらは高価であり、量産には適さない。

> 本発明に関連しているものとして、次のような 市販されている質量流量センサがある。このセン サは、空気やその他の測定ガスが通りぬける金属 管と、この金属管の1区域を抵抗加熱する変圧器 と、この区域に装着されている2ケの大きなヒー 40 トシンクと、この熱区域の中心とヒートシンクの 間の熱区域の中間に対称的に金属に取付けられる 2ケの熱電対から構成される。 金属管を通してこ の空気の流れが、上流にある熱電対を冷やし、下 流にある熱電対を熱する。変圧器が一定の電力で

る。

駆動されているとき、この熱電対の出力電圧の差 が質量流量の測定のめやすとなる。これはかなり 電力を必要とする大きな装置である。大きなダク トの内や、屋外での流量測定には適さないし、高 価であり量産もできない。

したがつて、次のような特性を有する流速セン サもしくは質量流量センサと、これに関連する信 号処理回路が必要とされている。寿命が長く、メ ンテナンスフリーで、小型で、低消費電力で、広 有し、そして広い速度レンジにわたつて直線性が あるかあるいは容易に直線化できる出力特性を有 するようなものである。更に量産が可能で、低価 格なものでなければならない。

を改善しようとなされたいくつかの試みが示され ている。これらの試みは、以下に述べるように、 一般的には、焦電材料は、シリコンとその半導体 特性を利用しようとするものである。これらの試 が、現在の流速センサとして求められている沢山 の特性に関して、いまだ不満足なものである。本 発明は、いかなる従来技術と比べても大巾にこれ らの要求を満足するように、技術的に進歩してい 技術について述べることにする。

ヒユイジング(*1)らが発明した流速センサ は、シリコンチップの両端近傍に埋め込まれた拡 散型トランジスタからなる同一の2ケの温度検知 素子と、これらの中薪心に配置されシリコンチツ 30 プを空気温度により45°C熱するための拡散型トラ ンジスタからなるヒータ素子から構成される。空 気が流れると流れの上流に位置する温度検知素子 は、下流に位置する温度検知素子よりもわずかに 流の差になり、電圧に変換されて空気の流速が測 定される。この温度検知素子は、感知できる程度 の温度差を実現するために、チップの対向する両 端に配置させなくてはならないが、それでも生ず ~0.2℃以下の温度変化にすぎない。

* I J. H. Huijsing, et al : IEEE Transactions on Electr n Devices, Vol.ED -29, No.1, pp.133-136, January, 1982

バツブツテン(*2)らが発明した流速センサ は、シリコンチップの向い合う各4辺上に埋め込 まれた同一の拡散型抵抗素子から構成される。す べての抵抗素子は自己発熱し、これによりシリコ 5 ンチップは流れてくる空気の温度によりかなり熱 せらられる。抵抗素子は電気的な2重ブリツヂ回 路で駆動される。空気の流れがないとき、すべて の抵抗素子は同一温度になるので、2重ブリッヂ 回路は電気的にパランスする。空気の流れがある 範囲な分野へ簡単に適用でき、大きな出力信号を 10 とき、流れに対して垂直な上流及び下流の抵抗素 子は、流れに対して平行な両側の抵抗素子より冷 やされることになる。この温度差が2重ブリツヂ のパランスをくずし、空気の流れ速度が測定され

文献にはこれらの要求に関連して、流速センサ 15 *2 A.F.P.Van Putten、et al: Electronics Letters. Vol.10. No. 21, pp.425 - 426, October, 1974

マリン(*3)らが発明した質量流量センサ は、大きなシリコン細片上の拡散型抵抗素子から みはいくつかの点で技術的な改善をもたらした 20 なる2ケのセンサと、そのセンサの間の中心に配 置される拡散型のヒータ素子から構成される。こ の技術は市販されている金属管を熱するタイプの 質量流量センサに類似している。空気の流れによ り、流れの下流に位置するセンサは熱せられ上流 る。次に、よく知られている最も関連が深い従来 25 に位置するセンサは冷やされるので、これらのセ ンサの温度の差がセンサ両端に生ずる電圧の差を もたらし、質量流量が測定される。

> K. Malin, et al : IBM Technical Disclosure Bulletin, Vol.21, No. 8. January, 1979

ラハナマイ(*4)らは、結晶学的に配置され る磨かれた単結晶のタンタル酸リチウムの薄い板 の背面全面に金属薄膜を付着させ、表面中心には 薄膜状に付着させたヒータ抵抗素子を配置し、こ 冷やされ、この2つの温度検知素子の温度差が電 35 れから同じ距離離れて配置される2つの薄膜電極 とから構構成されるセンサを開示している。ここ でタンタル酸リチウムの大きさは、長さ8=、巾 4 mm、最小板厚は0.06 mmである。文献に述べられ ているように、この板の下を空気が流れるように る温度差は小さく、 $0\sim50$ cm/秒の速度範囲で040するために、この板の両端を大きなネジ頭の上に 支持させている。上流と下流に位置する2つの電 一極は、背面の電極面との間で分離した同一のコン デンサを構成し、温度検知用のコンデンサとして 働く。動作は、例えば2~10Hzのような低い周波

数の電圧でヒータ素子を駆動することで、ヒータ 素子を、流れる空気の温度に対して周期的に熱す る。センサ素子も、タンタル酸リチウムと通して の熱伝導により、これに対応して周期的に熱せら れることになる。このタンタル酸リチウムは焦電 5 材料であることから温度に対応して分極を生ずる ことになるが、空気の流れがないときには、2つ のセンサに発生する周期的な分極電圧は同一のも のとなる。従つて空気の流れがないときの2つの られているように、空気の流れがあるとき、上流 に位置するセンサ素子は下流に位置するセンサ素 子よりも冷やされることになるので、これらのセ ンサの温度の差が電圧のの差をもたらし流速が測 定される。

H. Rahnamai, et al : paper presented at the 1980 International Electron Devices Society of IEEE, Wastington D.C., pp.680 -684, December 8-10, 1980

で技術的な改善をもたらしたが、現在のセンサと して求められている沢山の特性に関しては、いま だ不満足なものである。本発明は、これらの要求 を十分満足すべく技術を進歩させたものである。

薄膜の絶縁層で熱感知センサとヒータとを包んだ 2つの薄膜部材を、半導体基板の表面にエッチン グにより形成された空気スペースに位置するよう に、少なくともその一端が上記半導体基板に保持 て、かつ、極めて隣接して配置し得る構成とした ものである。

次に、第2の発明は、上記第1の発明の改良に 係り、第1および第2の薄膜部材を同一平面上に 保つべく連結取段を設けた構成とたものである。

更に、第3および第4の発明は、薄膜のヒー タ、一対の薄膜の熱感知センサに加えて、周囲の 温度をモニタするため、シリコン基板とヒートシ ンクとした周囲温度検出手段と、ブリツジ回路制 御手段を設け、薄膜のヒータを周囲温度より一定 *40* シリコン膜によるヒータ**26**の熱の損失は極めて の高い温度で駆動し得る構成としたものである。

本発明の具体的な実施例として、基板20は半 導体、その中でも特に精密なエツチング技術を応 用できる点と、チップの生産性の高い点からシリ

コンが選択される。そしてこの基板上に形成され る格子形状をなくす全く同一の測温抵抗素子は薄 膜の熱感知センサ22,24として働き、この2 個のセンサの中央部に配置される格子形状をなく す発熱抵抗素子は薄膜のヒータ26として働く。 熱感知センサ22,24及びヒータ26として は、鉄とニツケルの合金、例えば80%のニツケル と20%の鉄からなるパーマロイといたものを使う ことが適している。こられ熱感知センサ22,2 センサの間の電圧の差は0となる。文献でも述べ 10 4及びヒータ2は、例えば窒化シリコンからなる 薄膜の絶縁層28,39により包まれて、薄膜部 材を形成する。第1図及び第2図の実施例に示す ように、センサは、ヒータ26の半分と熱感知セ ンサ22からなる薄膜部材32と、ヒータ26の 15 半分と熱感知センサ24からなる薄膜部材34と から構成され、巾 150μ 長さ 400μ の大きさを有す

更に本発明で開示するセンサは、熱感知センサ 22,24及びヒータ26を効果的に囲む空気ス 前述したように、これらの試みはいくつかの点 20 ベース30を有する。この空気スペース30はシ リコンの表面36に微細構造をもつて形成され る。すなわち熱感知センサ22,24及びヒータ 2 6 は、約0.08~0.12μの厚さで線間に約5μの空 間を有する巾5μの緩からなり、しかもこれらは 本願の第1の発明は、熱伝導率の比較的小さい 25 全体の厚さが約0.8μ以下になるような窒化シリコ ンの薄い膜によつて包まれるように構成される。 そしてエツチングによりくぼみである空気スペー ス30か、薄膜部材32,34の下のシリコン基 板20の中に125μの深さで正確に形成される。 されることにより、上記基板と非接触状態にし 30 薄膜部材32, 34は、空気スペース30の1つ またはそれ以上のエッヂにおいて、シリコンの基 板20の表面36の最上部に接続される。例えば 第3図に示すように、薄膜部材32,34は、空 気スペース30を架橋するように、あるいは第3 35 A図に示すように片持ちばりで構成することもで きる。

> 窒化シリコンは非常に優れた熱的絶縁体であ る。薄膜部材32,34を包む窒化シリコンの膜 が極めて薄くかつ熱的絶縁もよいことから、窒化 小さく、ヒータ26から熱感知センサ22,24 に伝わる熱のほとんどがヒータ26を取り囲む空 気を通して伝えられることになる。 すなわち窒窒 化シリコン膜の熱伝導率が小さいことから、熱感

知センサ22と24をヒータ266に極めて隣隣 して配置することができ、ヒータ26からの熱の ほとんどは窒化シリコン膜を通らずにヒータ26 を取り囲む空気を通して伝えられることになる。 にささえられた熱感知センサ22,24は、ヒー タ26の面とその近傍の空気の温度を測定するブ ローブとして働くことになる。

空気の流速を検出するという本発明の原理を第 の温度より200℃高くなる一定の温度に加熱され る。このシリコンの基板20の温度は流れている 空気の温度とほとんど同じものである。具体的に は、シリコンの基板 2 0 がTO-100 タイプのメ なヒートシンクに搭載されている場合は、シリコ ンの基板20の温度は流れている空気の温度より 0.5℃程度高くなるにすぎない。又、ヒータ26 の温度を流れる空気の温度より200℃高く保つと ぎない。

ヒータ26からの熱伝導の大部分は空気スペー ス30も含んだ周囲の空気を通して行われるが、 本発明の実施例において空気の流れがないとき、 (200℃の約70%) に熱せられる。すなわち、図に 示すように、熱感知センサ22と24はヒータ2 6に対して正確に対称に配置されるので、空気の 流速が0のときにはこの2つのセンサの温度は同 ない。従つて0.1から1.0mAの微小測定の電流を 流しても、この2つの熱感知センサに電圧の差は 発生しないことになる。

空気の流れがあるときには、この実施例におい へ向う空気の流れにより熱が運び去られるので冷 やされ、一方、下流に位置する熱感知センサ24 はヒータ26からの空気の流れによつて熱せられ ることになる。これによつて生ずる熱感知センサ 22と24の間の抵抗値の差が電圧値の差をもた 40 て配置される。 らし流速が測定される。増巾しないときのこの雷 圧の差は、760cm/砂の空気の流れ速度において 0.1V程度のものである。

本発明においては、熱感知センサ22と24は

定電流で駆動され、前述したように空気が流れて いる状態のもとでの温度のパランスの変化を検出 するように構成されている。なお、2つのセンサ を定電圧モードで駆動するとか、定温度モード駆 そして、ヒータ26近傍の空気中に効果的に強固 5 動するとか、定電力モードで駆動するとかいうよ うに、信号に生じさせるような方法であればこれ に替わる他の方法で構成しても実現は可能であ

ヒータ26と熱感知センサ22,24の熱容量 2 図に基いて説明する。ヒータ 2 6 は、基板 2 0 10 が極めて小さいことと、基板への接続手段である 窒化シリコン膜により予えられる熱的絶縁性と、 空気スペース30の存在により、本発明の応答性 は測定結果によれば時定数が0.005秒と非常に速 いものとする。すなわち熱感知センサ22と24 タルヘッドもしくはサーデイブパッケージのよう 45 は空気の流れの変化に非常に速く応答できること になる。

本発明において、ヒータ26は空気の温度に対 して一定の温度となるように駆動され、熱感知セ ンサ22と24は定電流で駆動されることから、 いつても0.01Wより小さな電力が要求されるにす 20 熱感知センサ22と24の温度変化は抵抗値の変 化として検知されることになる。これらの機能を 実現するための回路例を第4図及び第5図に示 す。第4図に示された回路はヒータ26の温度を 制御するためのものであり、第5図に示された回 熱感知センサ22と24は平均温度で約140℃ 25 路は熱感知センサ22と24の間の抵抗値の差に 比例する信号電圧を得るためのものである。

本発明において周囲の空気の温度は、シリコン の基板20をヒートシンクとして形成される比較 抵抗38によつてモニタされる。比較抵抗38 一になり、この2つのセンサの抵抗値の差は生じ 30 は、熱感知センサ22,24及びヒータ26と同 様に格子状のパーマロイによつて構成されかつシ リコンの表面36上に絶縁層28と29に包まれ て配置される。

本発明において周囲の空気の温度は、シリコ て上流に位置する熱感知センサ22はヒータ26 35 ンの基板20をヒートシンクとして形成される比 較抵抗38によつてモニタされる。比較抵抗38 は、熱感知センサ22,24及びヒータ26と同 様に格子状のパーマロイによつて構成されかつシ リコンの表面36上に絶縁層28と29に包まれ

> 絶縁層28と29の厚さは合わせて0.8µと非常 に薄いため相対的に熱伝導がよくなることから、 これらの絶縁層の垂直方向を通して、熱感知セン サ22,24、ヒータ26、比較抵抗38にと熱

が出入りすることになる。比較抵抗38は絶縁層 に包まれて基板20の表面3.6に直接取り付けら れており、ヒータ26がまわりの温度より200℃ 高く熱せられていても周囲の空気の温度と0.5℃ 以内の範囲にある基板20の温度を容易にモニタ 5 できることになる。すなわち比較抵抗38は、基 板20の温度を検知することにより、それとほと んど一致する流れる空気の温度を検知することに

の温度を、比較抵抗38によつて検出される周囲 温度よりも高い一定温度に保つためのホイートス トンブリッヂ回路46により構成される。ここで 前述したように本発明の実施例では、この一定値 は約200℃に設定されている。ホイートストンプ 15 リツヂ回路46は、ヒータ26と抵抗40により 一辺を、比較抵抗38と抵抗42,44により一 辺を構成している。アンプ48と50からなる積 分回路は、出力の電位を変化させることでブリッ デ回路 4 6 がパランスするように動作し、ヒータ 20 26によつて消費される電力を一定に保つように する。

第5図に示す回路は、この実施例において空気 の流れの上流に位置する熱感知センサ22と、下 流に位置する熱感知センサ24との間の抵抗値の 25 差を検出するためのものである。この回路は、ア ンプ72からなる定電流電源部52と、アンプ6 8と70からなる差動増巾部54から構成され る。定電流電源部52は、1辺に高インピーダン ス抵抗56,58と、他辺に零調用可変抵抗60 30 及び熱感知センサ22,24を有するホイートス トンブリッヂ回路を駆動する。差動増巾部54の 利得は可変抵抗62により調整される。出力端6 4は熱感知センサ22と24の間の抵抗値の差に 比例する出力電圧する。

本実施例においては、アンブ48,50,6 6, 72には4ケのアンプをもつLM324の各々 のアンプを使用し、アンプ68と70には2ヶの アンプをもつOP-10の各々のアンプを使用して

本発明で開示するセンサの特徴の1つとして は、広いレンヂの空気の流れ速度に対して、熱感 知センサ22と24の感知する温度の差が大きく とれるようにと構成されている点があげられる。

この結果、空気の流れ速度の関数となる出力端6 4 の出力が大きくとれるので、流速測定の精度が 著しく高められ測定も容易となる。この温度の差 が大きくとれることを、本発明の具体的実施例に よつて得られる第6図に示す。すなわち、空気の 流れで冷やされる上流に位置する熱感知センサ2 2と、ヒータ26からの熱により熱せられる下流 に位置する熱感知センサ24という2つのセンサ の出力を結びつけることで、大きな温度差の効果 第4図に示される温度制御回路は、ヒータ26 10 が得られるのである。この熱することと冷やすこ とを結びつけて大きな温度差を得るためには、

- (1) 熱感知センサ22,24を空気と比較強く熱 的に接触させることが必要となる。すなわち熱 感知センサ22,24がシリコンの基板20か ら実質的に熱的に絶縁されなくてはいけない。 そしてこれは、薄膜部材32,34を包む窒化 シリコン膜の流手方向に沿つた方向の熱伝導率 が比較的小さいということ、薄膜部材32,3 4と基板20の間に約125μの深さで正確に形 成される空気スペース30により可能となる。
- (2) この実施例において空気の流れの上流に位置 する熱感知センサ22を大きく冷やすことが必 要となる。これには熱感知センサ22の温度を 高く設定する必要がある。そしてこれは、空気 スペース30を介することで熱感知センサ22 をシリコンの基板20から熱絶縁することと、 薄膜部材32の長手に沿つた方向の熱伝導率が 小さいということと、ヒータ26の温度を高く 設定することによつて可能となる。このヒータ 26の温度が高く設定できるためにも、空気ス ペース30を介してヒータ26をシリコンの基 板20から熱的に絶縁することと、薄膜部材3 2,34の長手に沿った方向の熱伝導率が小さ いということが必要である。
- 35 (3) この実施例において空気の流れの下流に位置 する熱感知センサ24を、ヒータ26からの熱 を伝えることで大きく熱することが必要とな る。これは空気スペース30を介することで熱 感知センサ24をシリコンの基板20から熱的 に絶縁することと、薄膜部材34の長手に沿つ 40 た方向の熱伝導率が小さいということと、ヒー タ26の温度を高く設定することによつて可能 となる。このヒータ26の温度が高く設定でき るためにも、空気スペース30を介してヒータ

26をシリコンの基板20から熱的に絶縁する ことと、薄膜部材32,34の長手に沿つた方 向の熱伝導率が小さいということが必要であ

6 のエツヂ部の間の距離を最適な値に選択する 必要がある。

第7図には、空気の流れ速度が0のときの理 想化された空気の温度分布曲線74と、空気の 空気の温度分布曲線 7.6 と、理想的に狭ばめら れた熱感知センサ22と24の最も適切な配置 距離を示す。ヒータ26に対して流れの上流側 は空気で冷やされることから、この温度分布曲 だけ下げられることになる。ここで、この△T 1はヒータ26の上流側のエツヂからD1離れ た位置で最も大きくなる。一方、流れの下流側 はこの流れによつて伝わる熱で距離の関数であ る。ここでこの△T2は、ヒータ26の下流側 のエツヂからD2離れた位置で最も大きくな る。D1とD2は等しい値である必要はない が、流れの速度が0のとき流速センサからの出 のときには熱感知センサ22と24の温度は等 しくしなくてはならない。このため本発明の望 ましい実施例としては、熱感知センサ22, 2 4が実際には巾をもつていることを考慮し、熱 センサ24の中心までの距離D2を等しくとる 必要がある。これから、D1とD2が等しいと いう条件の下で、符号を考えなけれは流速セン サの出力は最大となるので、熱感知センサ22 4上にわたる△T2の平均値の合計が最大とな ることになる。以上のことはある適当な位置で 起こることがみつけられており、数百フィー ト/分の流れ速度の速度レンヂにおいては、こ の長さである。

従来技術による施速センサではわずかな温度差 しか得られなかつたのに対し、本発明では具体的 数値を示すならば、860cm/砂の流れ速度におい

ては△T1の平均値と△T2の平均値の合計が約 50℃と比較的大きくとれる。これは、長手方向の 伝導率の小さい非常に薄い窒化シリコンの膜で源 膜部材32,34を包んだことと、熱感知センサ (4) 熱感知センサ22と24の中心と、ヒータ2 5 22, 24及びヒータ26を空気で囲むように空 気スペース30を設けたことで、熱感知センサ2 2,24及びヒータ26をシリコンの基板20か ら熱的に絶縁できるようになつたことから可能に なつたのである。熱感知センサ22,24及びヒ 流れ速度がある任意な値のときの理想化された 10 ータ26の下に形成される空気スペース30の巾 とくぼみの深さの寸法を正確につくるには、後述 する精密エツチング技術により実現される。この 空気スペース30が精度よく形成されることによ り、センサチップ間の熱的絶縁性のばらつきを均 線はこの側で距離の関数である△T1という値 15 一にすることができる。すなわち、センサチップ 間の空気の流れに対する応答のばらつきを均一に することができる。

従来技術では、これらのセンサエレメントは、 シリコンチツプのような基板に埋められるとか密 るΔT2という値だけ温度が上がることにな 20 着させられるとかいうような構成がとられてい た。このため、センサエレメントの有意な温度差 を取り出すために、センサエレメントをヒータの 巾に比較して長い距離だけヒータから離す必要が あつた。しかしこのような従来技術で得られる温 力が0となるようにするために、流れ速度が0 25 度差は、熱的な絶縁を基に構成される本発明のそ れに比べ、1/100程度の小さなものにすぎないの である。

ラハナマイらの従来技術を例にとるならば、ヒ ータとセンサのエレメントはタンタル酸リチウム 感知センサ22の中心までの距離D1と熱感知 30 板上に付着されている。(タンタル酸リチウムの 固有伝導度はシリコンのそれよりも小さいが、窒 化シリコンのそれよりも70%も大きな値を示す)。 ヒータとセンサのエメレントは少なくとも60μの 厚さを有するタンタル酸リチウム板に密着されて 上にわたる ΔT 1の平均値と、熱感知センサ 2 35 取付けられている。この 60μ という値は、本発明 の薄膜部材32,34を包む窒化シリコン膜の厚 さである0.8μという値に比べ75倍に厚いものなの である。リチウム基板に密脅したヒータエレメン トと、そのエツヂから 0~500μの間の距離に広 のD 1 (= D 2) の値はヒータの巾のほぼ1/2 40 がつて配置されるセンサエメレントとの間の熱の 伝導は、センサとヒータとの間の空気を介するも のより、60μのリチウム基板を介するもので支配 されてしまうのである。すなわち、ヒータは空気 によつて効果的に取囲まれてはいないため、ヒー

タからセンサへの熱の大部分はリチウム基板を通 して伝わつてしまうことになる。この結果、この 500μの巾を有するセンサは、本発明に比べ、空 気の流れに対してわずかな温度の値しか変化でき タのエツヂから 0~100μの間の距離に広がって 配置される。

従来技術に対しての本発明のもう1つの長所 は、熱感知センサ22,24及びヒータ26をシ リコンの基板20から効果的に熱絶縁させるため 10 の特性も比較のために示してある。 に設けられる空気スペース30である。これによ り前述したように、シリコンの基板20の温度は おおよそ0.5℃以下という、ほとんど無視できる 温度上昇に押えることができることになる。この リコン基板とそれを支持するハウジングといった ものとの間の熱的接触に全く依存しないというこ とになる。これに対し従来技術では、センサの出 力特性は取付け本体との熱的接触に大きく影響さ も、出力特性は、取付け構造の方法に大きく影響 されている。ヒユイジングらの従来技術において も、シリコンチップの固定台が流速に対する出力 特性を悪くしていることが述べられている。 パン プの熱的なショートを最小にするためにシリコン チップを普通に使われている200μから50μにと薄 くしているが、このために固定台からの熱伝導に より感度の低下を受け易くなる。マリンらの従来 リコンの細片が用いられているが同様に固定台の 影響を受けてしまうことになる。

本発明の2番目の長所は、広い流速レンヂにわ たつて、熱感知センサ22と24の温度の差の直 線性がよい点にある。従来技術においては、この 35 う。一方、熱感知センサ22の内側部分はヒータ 温度の差は、流れ速度の平方根に比例している。 この依存性のために、放物線的な出力特性として 知られているように、流れ速度がVのときに流速 がある値変化すると、2つのセンサの温度の差は その $\frac{1}{2\sqrt{V}}$ 倍だけ変化することになる。このよ うな増分特性であるから、流速が速くなるほど変 化は小さいものになつてしまう。その結果、電子

回路のノイズやドリフトによつて誤差を受け易く

なるのである。本発明は流速の変化に対しての出 力特性の直線性が良好であるとともに、例えば 0 ~1016cm/砂あるいはそれ以上の流速領域で得ら れる電気出力信号が増巾しないでも大きく取れる ないことになる。ここで本発明のセンサは、ヒー 5 ため、速い流速測定においてもドリフト等による 誤差をほとんど無視できる程度にまで減らすこと ができる。本発明によるセンサの、流速に対する この温度差の典型的な出力特性を第8図に示す。 この図には合わせて、ヒユイジングからのセンサ

具体的な実施例として前述したように、本発明 のセンサにおいて、ヒータ26の全抵抗値は第4 図に示した回路により、任意の周囲温度において 一定に保たれる。上述したような直線性のよい特 ため、本発明では、流速に対する出力特性は、シ 15 性は、ヒータ26の近傍の温度分布に傾斜がある 領域(第7図参照)の大部分をカバーするように 十分広くまた適切に配置された熱感知センサ22 と24を用いることで得られる。

このような構成にあつて、熱感知センサ22の れていた。事実、ラハナマイらのセンサにおいて 20 内部エツヂ76は、ヒータ26の近接エツヂ78 に極めて隣接(例えば5μの線巾)して配置され ている。空気の流れがないとき、近接エッヂ78 からこの程度離れた近傍の空気温度はほとんど近 接エツジ78の温度に一致する。具体的実施例と プツテンらの従来技術においても、シリコンチツ 25 して、熱感知センサ22と24はおおよそ100μ の巾を有していることから、熱感知センサ22の 外部エツヂ80はヒータ26の近接エツヂ78か らおおよそ100μ離れて配置されている。空気の 流れがないとき、この100μ程度離れた位置での 技術においても、熱的もろさを防ぐために長いシ 30 空気温度は、ヒータ26の温度より周囲の空気温 度すなわちシリコン基板の温度に近いものとなる (第7図参照)。このため、熱感知センサ22の外 部エツヂ80は、遅い空気の流れ速度でも簡単に シリコンの基板20の温度近くに冷やされてしま 26により密接に熱的に結合されているの、で速 い空気の流れに対しても、シリコン基板の温度近 くに冷やされることはなく、速い空気の流速に容 易に応答する。熱感知センサ22の各々の格子部 40 からの温度変化効果が合成されると、流れの上流 に位置するこのセンサの流速に対する温度特性 は、広い流速レンヂにわたつてより一定なものと なる。この特性は、ほぼ従来技術の場合に相当す るヒータのエツヂから離れたいかなる位置にある

単一の点素子またはライン素子による特性と、対 照をなすものである。 本発明の望ましい具体例に より実測された熱感知センサ22の広い流速レン **ずにわたつてのこの直線性のある温度特性を第6** 図に示す。

流れの下流に装置する熱感知センサ24につい ては、空気の流れによる熱伝達により抵抗値の増 加が発生するが、上流に位置する熱感知センサ2 2の空冷による抵抗変化よりは小さいものであ エツヂ84とヒータ26の近接エツヂ86との間 隔は5μ、熱感知センサ24の外部エツヂ88と ヒータ26の近接エツヂ86との問隔はおおよそ 100μと、従来技術に比べて近接しているので、 による熱伝導は広い流速レンヂにわたつて効果的 なものとなつている。主に空気スペース30によ るこの効果的な熱伝達と熱感知センサ24の熱的 絶縁により、広い流速レンヂにわたつて、流速の 昇することになる。本発明の望ましい具体例によ り実測された、下流に位置する熱感知センサ24 の流れ速度に対しての温度変化を第6図に示す。 上流に位置する熱感知センサ22と、下流に位置 すると、第8図に示す特性が得られる。この図か ら、ヒユイジングらの従来技術の特性カープと比 較して、広い流速レンヂにわたつて直線性がある 点、そして大きな信号レベルが得られる点がわか

本発明のセンサの流れ速度に対して大きな出力 特性を有するという利点の1つとしては、センサ 寿命を長くし乱流の影響からのがれるために流れ 速度を減ずることが望まれているような分野への では、空気の流れがシリコン基板面に平行となる ことと、シリコン基板面上に流れの遅い表面層が 形成されるので空気の流れの速い領域は実質上こ の表面層から離れることになることから、薄膜の 空気に含まれる粒子の衝突による損傷からまぬが れることができるという利点もある。

第2図において図式的に表わした熱感知センサ 22, 24及びヒータ26を、一実施例である第

9図に詳細に示す。開口部82は、後述するエッ チングを容易とするために窒化シリコン内に刻ま れる。リード部92とパーマロイ板90は、薄膜 部材32と34上における対称的な熱伝達特性を 保証するために対称的に作られる。この実施例で は、薄膜部材32と34の大きさは、おおよそ巾 150μ、長さ300μである。熱感知センサ 2 2, 2 4及びヒータ26の厚さは0.08µであり、熱感知 センサ22,24の抵抗値は740Ωで、ヒータ2 る。しかし本発明では、熱感知センサ 2 4 の内部 10 6 の抵抗は840 Ω である。熱感知センサ 2 2, 2 4の大きさは、おおよそ巾100μ、長さ175μであ る。前述したように、熱感知センサ22と24は ヒータ26から1ライン巾(5μ)分、離れてい る。すなわち、熱感知センサ22の内部エッヂ7 ヒータ26から熱感知センサ24への空気の流れ 15 6はヒータ26の近接エッヂ78から5m、熱感 知センサ24の内部エツヂ84はヒータ26の近 接エツヂ 8 6 から5μだけ離れている。本発明の 他の実施例については、特に述べないならば熱感 知センサ22,24及びヒータ26の厚さは 増加とともに熱感知センサ 2 4 の温度が大きく上 20 0.08μ であり、格子を形成する線の巾は 5μ で線間 の距離は5μであり、この格子は80%のニッケル と20%の鉄からなるパーマロイで構成されている ものとする。本発明に述べられている他の寸法と 同様に、これらの値は実際のデバイスにおいて使 する熱感知センサ24の流速に対する特性を合成 25 われた適切なものではあるが、アプリケーション に応じて変えるべきものであるからして、これに 限定するものではない。

本発明の他の実施例を第10図に示す。第9図 に示される実施例と同様に、第10図に示す実施 30 例も、空気スペース30を架構する32A,34 Aとラベル付けされた2つの薄膜部材から構成さ れる。そして、分割されたヒータ26Aが用いら れており、薄膜部材32A上にこのヒータ26A の半分が薄膜部材34上にこのヒータ26Aの残 適用を促進させるという点がある。また本センサ 35 り半分が配置される。センサ22A, 24Aは、 前述した熱感知センサ22,24より狭く、その 大きさは、おおよそ巾90μ、長さ175μである。そ の上、センサ22Aと24Aは、ヒータ26Aか ら25μと、前述した実施例よりも離て配置され 熱感知センサ22,24及び薄膜ヒータ26は、 *4*0 る。すなわち、センサ22Aのエッヂ76Aはヒ ータ26Aのエツヂ78Aから25μ、センサ24 Aのエッヂ 8 4 Aはヒータ 2 6 Aのエッヂ 8 6 A から25μだけ離れて配置されている。この実施例 では、薄膜部材32A,34Aの大きさはおおよ

そ巾150µ、長さ350µであり、センサ22A、2 4 Aの抵抗値は670Ωで、ヒータ 2 6 Aの抵抗値 は840Ωである。更に第10図の実施例において は、薄膜部材32Aと34Aは、パーマロイ板9 る。この連結部94は、薄膜部材32Aと34A を同一平面上に保つための役割を果す。リード部 92Aは、薄膜部材32A, 34Aの中心部の強 度を増すために、蕁膜部材32A,34Aの中心 線に沿つて配置される。

予備実験によれば、同じ流れ速度についてみる ならば、第10図の実施例の出力は、第9図の実 施例の出力より約100%も大きいものであつた。 しかしながら、これらの実験において、第9図の 配置させたが、一方第10図の実施例はチップの 端に配置させた。そのため、第11図に示すよう に空気スペース30Aの上流部分が開かれるか、 あるいは第12図に示すように空気スペース30 遮られないので、空気がより流れ易くなる。第1 1図の配置例と第12図の配置例では、どちらも チップの中心に配置する第9図の配置例より出力 特性は大きくなるのであるが、第11図の方が第 図の実施例が第9図の実施例より大きな出力を示 した点について、配置位置の違いからきているの か、設計上の違いからきているのか、あるいはそ の両方が関与しているのか、いまだ判明していな 先端エツヂの少なくとも一部分を取り除くという 変更ができることを書き留めておく。すなわち、 例えば基板 2 0 A の部分 1 1 8 を線 1 2 0 のとこ ろまで取り除くことで、薄膜部材32Aの先端エ る。そして、第11図の実施例が、チップの中心 に配置された第9図の実施例よりかなり大きな出 力特性を示したことについては、少なくとも以下 に示す2つの観点から説明され得ることを書き留 めておく。第1の点は、前述したように第11図 40 のである。 の実施例では空気スペース 30 Aの上流部分が開 かれるので、側壁によつて遮られない流れを受け ることになるからである。このように、この薄膜 部材32Aと34A、特に32Aの先端エッヂ部

はより流れを受け易くなることになる。第2の点 は、第17図に示すように、シリコン基板20A の先端エツヂから始まる自由流速包絡線37A が、第16図に示すシリコン基板20の先端エッ 6によつて強化された連結部94により連結され 5 ヂから始まる自由流速包絡線37より、薄膜部材 32A, 34Aを高速の流速に近く置いているこ とがわかる。包絡線37の場合、第16図に示す 薄膜部材32,34は、第17図に示す薄膜部材 32A, 34Aに比べ速い流れ速度に対して遠く 10 なることから、速い流速に露出されることも少な くなる。

第13図に示す実施例では、センサ22C,2 4 Cとヒータ2 6 Cは、空気スペースを架橋する 別々の薄膜部材上に配置されている。この実施例 実施例は第1図に示すようにチップの中心位置に 15 では、ヒータ26Cはセンサ22C,24Cの近 い方のエツヂから50μ離れて配置される。すなわ ち、ヒータ26Cのエツヂ78Cはセンサ22C のエツヂ76 Cから50以 ヒータ26 Cのエツヂ 8 6 Cはセンサ 2 4 Cのエツヂ 8 4 Cから50u離 AAの下流部分が開かれることになり側壁により 20 れて配置される。この実施例では、センサ22 C, 24 C及びヒータ26 Cの抵抗値は1000Ω で、大きさはおおよそ巾135μ、長さ150μである。 そして3つの架橋部の大きさはおおよそ巾150点 長さ300μである。パーマロイ板 9 D C は薄膜部 12図よりもかなり大きな出力を示した。第10 25 材の強度を増すためと、リード部92Cからみて 架橋部の両端の熱伝達特性をほぼ同じものとする ために加えられる。

第13図に示すセンサの出力特性は、第9図及 び第10図に示すセンサの出力特性よりかなり小 い。第11図の実施例においては、基板20Aの 30 さなものであつた。これは、ヒータ26Cとセン サ22C,24Cとの間を50µと広げたことと、 センサの巾を大きくしたことでセンサとヒータと の中心線の距離が広がつたことに起因していると 考えられる。従つて第13図の実施例と関連づけ ツヂの露出を大きくさせていくといつたことであ 35 て第7図を参照するならば、センサ22Cと24 Cの中心線は適切な距離D1, D2よりかなり離 れて配置されることになり、その結果、一定の流 れ速度においてセンサ22Cと24Cとの間で得 られる平均的温度差はかなり小さくなつてしまう

> 第7図に関連して前述したように、1つのセン サ全体にわたつてAT1の平均値と、他方のセン サ全体にわたつてのAT2の平均値の合計値を最 大にするようにすることが望ましい。これは理想

的には、抵抗値は非常に小さなものとなるが非常 に狭いセンサエレメントを使うことで、最も適切 に実行できるであろう。しかしながら実用的な回 路的考察から、センサの抵抗値は少なくとも ることが望ましいのである。この要求と、薄膜部 材構造の長さにかかる実際的制限と、気流密度上 の制限と、これらと関連する抵抗素子の薄膜の厚 さとを結びつけると、適当な抵抗値を実現するた あるということになる。これらのことから、望ま しい実施例のセンサの巾はそれ程狭くできなく て、多少の巾を有することになる。第7図に示さ れた理想的な温度カープ上のAT1の平均値とA 75μかそれ以上という結果となつたが、センサの エツヂをヒータのエツヂに近づけなくてはならな いため、第9図の実施例において、窒化シリコン の絶縁層を通してヒータからセンサのエッヂに伝 る。従つて出力特性も最大となろうというものよ りは小さくなつてしまう。5μというわずかなス ペースにしたことにより、実測された出力特性は 従来技術の3~5倍であつたが、第10図の実施 さなものであった。これらの考察の結果から次の 結論が導き出される。実施例において、他の寸法 を等しいままにして窒化シリコン膜の厚さ0.8μを 厚くすると、流速に対する出力特性が大きく低下 通しての熱伝導が増加することで、センサはヒー タにより密接に熱的に接合されてしまうことにな るからである。

第13図の実施例の考えられる欠点としては、 別々の薄膜部材上にあることから、製造過程を通 しての色々な種類の物理的変形といつたもので、 ヒータとセンサの1部が同一平面でなくなりがち になることにある。この欠点は、第9図及び第1 とに注意しておく。すなわち、各々のセンサは直 ので、ヒータとセンサはほぼ同一平面上にあるこ とが保証されるのである。

第14図に示す実施例において、連結部94D によつて連結された薄膜部材32D, 3.4Dは、 各々その上にヒータ26Dとセンサ22D,24 Dの半分ずつを直列に配置して、空気スペース上 100 Ω 以上は要求され、700 Ω から1000 Ω の間にあ 5 に架橋されている。センサ22Dと24Dの熱的 パランスを保証するために、パーマロイの格子2 2D, 24D, 26Dとパーマロイ板90D, 9 0 DD及びリード部 9 2 Dは、180°の回転対称を 有している。パーマロイ板90Dは、薄膜部材の めに、センサ格子の巾は少なくとも75μは必要で 10 中心線に沿つた強度を増すために設けられ、パー マロイ板90DDは薄膜部材の中心線に沿つた強 度を増すとともに、対照的な熱伝達特性を与える ためのものである。この実施例において、空気の 流れは、今まで述べた薄膜部材の横方向に沿つて T2の平均値の合計を最大にするためには、巾が 15 合わされる実施例とは異なる、典型的には薄膜部 材の流さ方向に合わされる。センサ22D,24 Dは比較的狭く、各センサの半分の大きさは巾 75μ、長さ135μである。ヒータ**2**6 Dのエッヂと センサ22D, 24Dは25μ離されている。各薄 わる望ましくない熱は無視できるものではなくな 20 膜部材上に、センサ22D,24D及びヒータ2 6 Dの半分ずつをもたすことが、同一平面を保証 することを助けている。第14図の実施例におい て、各薄膜部材の大きさは巾150μ、長さ480μで あり、ヒータ26Dの抵抗値は1300Ωで、センサ 例の出力特性とはほとんど同じかむしろいく分小 25 22D, 24Dの抵抗値は 1050Ω である。この実 施例の流れに対する出力特性は、前述した実施例 に比べて小さなものである。これは、薄膜部材の 下の空気が流れが比較的小さいことと、センサが 空気スペースの壁に、より近いためシリコン基板 することになる。これは、厚さを増すと、これを 30 と熱的により密接に結合されていることに起因し

第15図に示す実施例では、空気スペースを架 **櫨する薄膜部材は1つにより構成されていて、流** れは典型的には薄膜部材の流さ方向に合わされ ヒータと2つのセンサが空気スペースを架橋する 35 る。この薄膜部材の大きさはおおよそ巾1504、 長さ480μであり、ヒータ26Eの抵抗値は710Ω、 センサ22E, 24Eの抵抗値は440Ωである。 抵抗値が小さい点と、エレメントが1つの薄膜部 材上に配置さている点を除けば、この実施例は実 0 図の実施例では実質上無視できるものであるこ 40 質的に第14図の実施例と同一のものであり、バ ーマロイ板90Eとリード部92EEは薄膜部材 接同一薄膜部材上にあるヒータの一部に隣接する の中心宣に沿った強度を増し、リード部 9-2 E と 9 2 EEは180°の熱的な対称性を与える。

第14図、第15図、に示された実施例におい

ては、ヒータとセンサは薄膜部材の長手方向に沿 つて配置されており、空気の流れも図示されてい るように典型的には薄膜部材の長手方向と平行に なるように配置される。空気の流れが薄膜部材の が発生する可能性があるのに対して、これらの実 施例の長所は、この小さな乱流を引き起こさない 連続的な表面を保証するということにある。第1 4 図の実施例に関連して述べたように、空気の流 られる欠点としては、空気の流れを薄膜部材の横 方向に合わせる実施例と比べ、薄膜部材の下の空 気の流れが殆どなくなることである。

- 本センサを製造するプロセスは、(100) の結晶 表面36には窒化シリコンの絶縁層29が形成さ れる。この絶縁層29は典型的には4000人の厚さ であり、普通の低圧ガス放電のスパツタリング技 術により付着され形成される。次に、典型的には 一様な層を、800Åの厚さをもつて窒化シリコン 膜上に、スパツタリングにより付着させる。

適当なフオトマスクとフオトレジストエツヂン グ液を使うことにより、第2図の22,24,2 かれる。

そして2番目の窒化シリコンの絶縁層28が、 スパツタにより付着される。この層の厚さは典型 的には4000Åであり、抵抗素子を酸化から防ぐた めに形成される。

薄膜部材32,34を形成するために、閉口部 82 (他の実施例では82A, 82C, 82D, etcとラベル付されている) が、窒化シリコンを 通して(100)結晶面のシリコン表面までエツチ 計上の選択の問題である。破線114(他の実施 例では114A, 114C, 114D、etcとラ ペル付されている)が空気スペース30のおおよ その形状を表わしている。

ツチング液を使い、制御された方法により、薄膜 部材32,34の下のシリコンをエッチングす る。エツチング液としては、KOHとイソプロバ ノールアルコールを混合したものが適している。

空気スペース30の傾斜面は、エッチング液に対 して抵抗性のある(111)あるいは他の結晶面に より囲まれている。空気スペース30の底面は、 エツチング液に対してほとんど抵抗性のない 横方向に合わされたとき表面の形状で小さな乱流 5 (100) 結晶面であり、薄膜部材32,34から一 定の距離すなわち125μの深さの位置におかれて いる。この深さは、エッチングの時間を加減する ことで実現される。空気スペースの深さを制御す るために、ホウ素をドープしたようなエッチング れを薄膜部材の長手方向に合わせる実施例の考え 10 を停止させるストップ層を用いることもできる が、本発明の形成には特に必要ではない。エッチ ングの時間を加減することで、空気スペース30 の深さは約3μの精度もしけは約2%で制御でき ることになる。この精度が、薄膜部材を取り囲む 面を有するシリコンウエハーが用いられ、これの 15 空気スペースの熱伝達特性と、空気の流れ速度に 対する特性の正確な再現制を導き出すことにな

第3A図に示されるような片持ちばかりの薄膜 部材の下や、第3図に示されるような架橋する薄 80%のニッケルと20%の鉄からなるパーマロイの 20 膜部材の下を有効的に削りとるために、第2図に 110として示される薄膜部材34の直線エッヂは、 シリコンの〔110〕結晶軸に対して0でない角度 112をもつて配置される。(本発明においては、 薄膜部材の直線エツヂもしくは軸を、シリコンノ 6, 38示すようなパーマロイのエレメントが描 25 [110] 結晶軸に対してある角度で配置するという 内容も含んでいるが、薄膜部材のエッヂを直線に 形成しない、もしくは軸が容易に決定できないよ うな形に薄膜部材を形づくることもありうる。し かしながらこれから述べるように、薄膜部材の配 30 置は、このアンダーカットを最小時間で実現する ような角度をもつて配置される。)

角度112をほぼ45°とすることによつて、薄 膜部材の下を削りとる時間、最小とすることがで きる。更に角度を0°としないことで、第3図に示 ングされる。開口部82の大きさは、ほとんど設 35 されるような両端を接続しているブリッヂの製作 が可能となるのである。すなわちこのような架橋 する薄膜部材は、薄膜部材の直線エツヂをほぼ 〔110〕軸方向に配置させたのでは形成することが できない。これは薄膜部材の直線エッヂが[110] 最後に、窒化シリコンをいためない異方性のエ 40 軸方向に配置されていると、この直線エッヂに沿 つてさらされる(111)結晶面に対して、異方性 のエッヂング液が削りとつていかないことからき ている。

角度112を45°にすると、半導体と薄膜部材

との支持境界面をすばやく丸め、平たんにするこ とになる。これにより、45°に角度を持たない場 合に発生する窒化シリコンの絶縁層29の下の2 つの(111)結晶面の交差点における応力集中点 をなくすことができる。

前述したように、いくつかの応用例において は、2つの薄膜部材を連結手段を用いて連結する ことが望ましい。(この連結手段としては、例え ば第10図の連結部94や第14図の連結部94 各々の薄膜部材と空気スペース30の底との間の スペースを一様に保つように働く。すなわちこれ らの間の熱伝達特性の一様性を保つとともに、デ バイス内での特性の均一性を補助するのである。 材上には、抵抗素子を1つもしくはそれ以上の素 子を配置するか、1つの素子と他のエレメントの 一部を同時に配置させた方が好都合である。(第 1, 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15図参 照)。第9図の薄膜部材32と34の架橋部の両 20 終端にみられる小さなエッチング用の長方形の閉 口部82は、薄膜部材32と34の下のシリコン の基板20のアンダーカツトをより形成しやすく するために設けられる。しかしながら、このよう くても、センサの性能は満足される。

第3図及び第3A図には、第4図及び第5図に 示されるような回路の集積化のための領域 1 1 6 も示されている。これらに示された実施例におい 178μ 、流さ254 μ ~508 μ 、厚さ0.8 μ ~1.2 μ である。 典型的にはパーマロイからなる、熱感知センサ2 2, 24、ヒータ26、比較抵抗38は、おおよ そ800Å (典型的には800Åから1600Åの間にあ ℃において、おおよそ200Ω~2000Ωの間にある。 なおパーマロイの抵抗値は、温度が室温から400 ℃になると、おおよそ3倍の値に上昇する。パー マロイ格子の線巾は約5μで線間も約5μとするこ とができる。空気スペース30の深さは典型的に 40 害な因子ではない。 は125μであるが、この深さはおおよそ25μから 250μの間で容易に変えることができる。シリコ ンの基板20の厚さは、典型的には200μである。 以上に示したこれらの値は一例にすぎず、これに

限定するものではない。

薄膜部材の大きさが上述の典型的なものである と、熱容量は非常に小さなものとなる。薄膜部材 とヒータと熱感知センサの熱容量が極めて小さい 点と、これらが窒化シリコン層という薄い絶縁手 段により基板に支持されることで熱的に絶縁され ている点と、これらを取り囲む空気スペースの存 在により、応答時間は非常に短いものとなる。実 測されたところでは時定数は0.005秒であつた。 Dを参照)。第10図において、連結部94は、10 したがつて熱感知センサが空気の流れの変化に対 して非常にすばやく応答できる。また、望むなら ばヒータを50Hzもしくはそれ以上の周波数でパル ス的に駆動させることも可能となる。

ヒータ26の動作温度は、典型的には100℃~ 同様な理由により、前述したように l つの薄膜部 15 400℃の間に設定されるが、望ましい動作温度と しては周囲に対しておおよそ200℃高く設定する。 パーマロイ素子を用いるならば、これはわずか2 ~3mWの電力にて実現できる。こういう電力レ ベルあれば集積回路で対応できるので、前述した ように望むならばセンサとともに同じシリコン基 板上に製作することも可能である。

25℃において600Ωから1000Ωの間の抵抗を有 するヒータ抵抗素子を使うならば、2~3Vの電 圧、2~3mAの電流を用いることで適切な動作 な小さなエッヂング用の長方形の閉口部 8 2 がな 25 温度になるための電力消費を与えることになる。 又、本実施例において、パーマロイのヒータ素子 の抵抗値を600Ωから1000Ωの間に選択したのは、 エレクトロマイグレーションによる素子の損傷と いう因子もあるからである。エレクトロマイグレ て、薄膜部材の典型的な大きさは、巾 $127\mu\sim~30~$ ーションとは電流密度がある臨界値を越えると き、物質の移動によつて引き起こされる導電体内 部の損傷メカニズムであり、温度に依存してい る。パーマロイに関してのこの臨界値は25℃にお いて10×10fA/aiのオーダである。望ましい実 る)の厚さで、その抵抗値は室温すなわち20~25 35 施例として、ヒータ素子の抵抗値は典型的には 600Ω~1000Ω、線巾は5μ、そして厚さは0.08μに 設定されているので、電流密度は実質的に約0.6 ~10°A/aiより小さなものとなる。この程度の 電流密度では、エレクトロマイグレーションは有

> 工業上で用いられている標準の温度センサのイ ンピーダンスは100Ω程度である。しかしながら 本発明の目的からして、そのような小さい抵抗値 のセンサは、本発明の実施例において用いられて

いる25℃で600Ω~1000Ωの抵抗値を有し厚さが おおよそ0.08μのものに比べて、望ましいもので はない。例えば、製造する上で、上流と下流に位 置する2つの熱感知センサの抵抗値は0.1%の程 は、より高い抵抗値を使うことでより容易とな る。その上より高い抵抗値のセンサを用いれば、 シリコンチップ上のリード部に関係する抵抗値の 違いとつた望ましくない影響も減ずることができ よる電圧の変化を、小さな電流で正確に得ること にするためには、より高い抵抗を使うことが必要 となつてくる。加えるに、小さな電流を使えば、 熱感知センサ自身の自己発熱を避けることができ る。この場合、この熱感知センサの自己発熱は、 15 ヒータの熱の場を変化させ、空気の流れに対する 温度感度を減少させるのであるが、そうひどい影 響とはならない。加えるに、熱感知センサに流れ る電流が大きくなると、空気の流れがないときの くな影響を大きくしてしまうことになる。

製造上の目的からすれば、ヒータと熱感知セン サの両方のパーマロイの厚さを同じに選べば、よ り簡単になり、より経済的になる。この観点か 知センサの抵抗値は、典型的には0.08μ厚のパー マロイにより似たような値であるとともに容易に 実現できる値となつている。

沢山の計画中の応用に関しても、本発明の望ま しい素子は、前述したきたように、パーマロイの 30 は、開示したような微小構造とのかね合いから、 抵抗素子である。薄膜部材32,34が薄い窒化 シリコン層に包まれているので、パーマロイ素子 は空気による酸化から防がれて、400℃を越す温 度のヒータ素子としても用いることが可能とな る。このパーマロイ素子の抵抗の温度依存性は白 35 更に前述したように、薄膜部材をシリコン結晶面 金と類似しており、どちらも0℃において 4000ppmの抵抗温度係数を有している。しかしな がら、本発明の構造に対しては白金よりもパーマ ロイの方が優れている。白金も温度検知用の抵抗 素子として普通に使われているが、パーマロイ白 40 ことで25~250μといつた深い空気スペースを形 金のおおよそ 2 倍の抵抗値を有するという利点が ある。しかも、薄膜状でみるならば、パーマロイ の抵抗温度係数は800~1600Åの厚さで最大をと るが、一方、白金は少なくとも3500人の厚さにな

つてしまう。パーマロイの抵抗温度係数はおおよ そ1600人の厚さで最大となるが、本発明で800人 を選んだのは、抵抗値が2倍になる点と、抵抗温 度係数も1600Åの値からわずかに小さいにすぎな 度の精度で一致させることが望ましい。この一致 5 いからである。従つて800人の厚さのパーマロイ 紫子を用いることで、白金に要求されるわずか1/ 8の表面積で同じ抵抗値を実現できることになる。 すなわち、パーマロイを使うことでヒータとセン サの熱効率を増せるとともに、要求される表面積 る。更に、空気の流れがわずかに変化したことに 10 を小さくできるので価格も下げられることにな

> すなわち、本発明においては、開示したよう に、パーマロイ素子は微小構造の温度変化検出セ ンサ素子とヒータ素子の両方に用いられる。

更にパーマロイからなるヒータとセンサを1μ 程度の厚さの窒化シリコンの絶縁層中に包み込む ことで、特に高い温度で問題となる酸化の現象に 対しての保護膜を提供している。窒化シリコンの 絶縁層は、シリコン基板からパーマロイ素子を熱 2つのセンサの間の色々な不一致といつた望まし 20 的に絶縁する機能も有する。そして窒化シリコン は、エツチングに対して高い抵抗性を有している ことから、薄膜部材32,34の寸法を構度よく コントロールすることもできる。更に、この窒化 シリコンの有しているエッチングに対して高い抵 ら、前述したように本実施例でも、ヒータと熱感 25 抗性の特性から、空気スペース30の深さをエツ チングにより25~250μといつたように深くでき ることになる。この空気スペースは、最も重要で ある熱伝達因子を決定する。

> 以上のように、本発明の望ましい実施例として パーマロイで熱感知センサとヒータを形成する。 窒化シリコンの絶縁層は支持用材料として、また 望む構造を形成するために必要なエツチング時間 を実現するための保護的材料として用いられる。 に対して適切に配向させることで、人工的なエッ チング停止手段を使うことなく望む構造を形成で きるとともに、最小時間で削りとることができる ことになる。更に、異方性のエッチングを用いる 成することにより、抵抗素子を集積化半導体デバ イスに普通に配置する方法に比べて、大きな熱的 絶縁が実現されることになる。

本発明の要旨は、実施例に述べてきたものに限

定されるものではない。例えば、熱感知センサ素子やヒータ素子はパーマロイに限ぎるものではなく、適切なものであれば何でもよい。他の例としては、酸化亜鉛膜のような焦電型材料や、薄いフィルム状の熱電対や、半導体材料のサーミスタ膜 5 や、パーマロイ以外の好ましい抵抗温度係数をもつ金属膜があるであろう。注意しなくてはいけないことは、本文では時々、測定される流れの媒体としては空気であることを述べてきたが、本発明は他の沢山のガス性の物質に対して応用できるも 10 のであることを加えておく。すなわち、本発明の

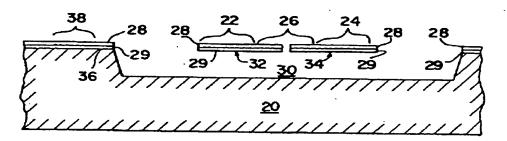
応用上の目的からして、"空気" と使われる言葉 の意味は一般的なガス性の物質を含んでいると定 養することにする。

図面の簡単な説明

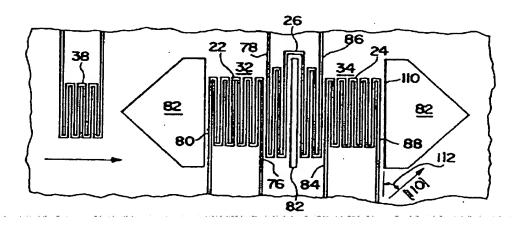
第1,2,3,3A図と第9~15図には、本発明の実施例を示す。第4図と第5図には、本発明に使う回路例を示す。第6,7,8,1617図には、本発明の特性図を示す。

としては空気であることを述べてきたが、本発明 20……基板、22,24……熱感知センサ、は他の沢山のガス性の物質に対して応用できるも 10 26……ヒータ、28,29……絶縁層、30…のであることを加えておく。すなわち、本発明の …空気スペース、32,34……薄膜部材。

第1図

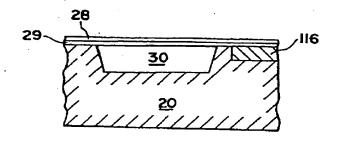


第2図

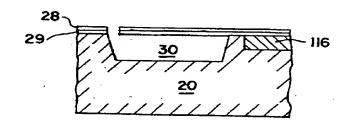


主人の教育を発展していた。

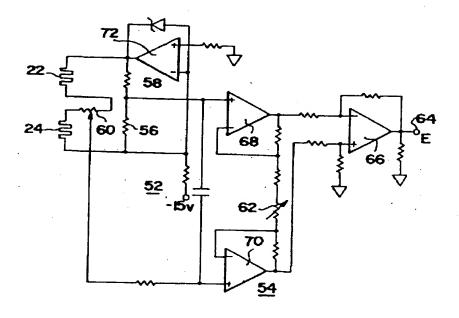
第3図



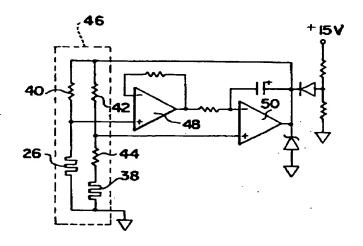
第3図 A



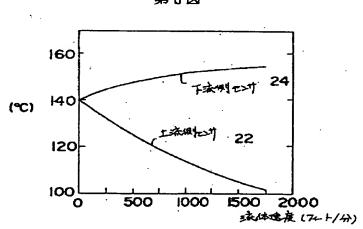
第5図



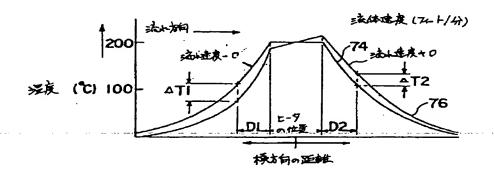
第4図



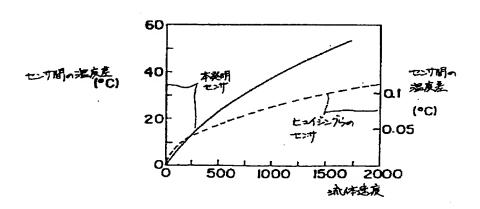
第6図



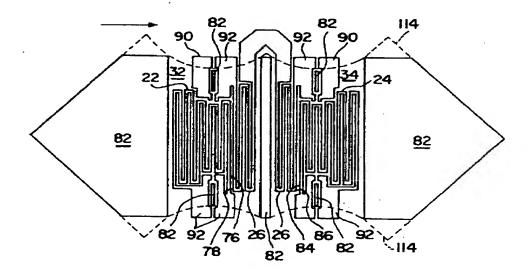
第7図



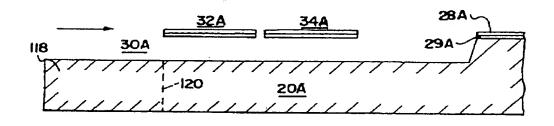
第8図



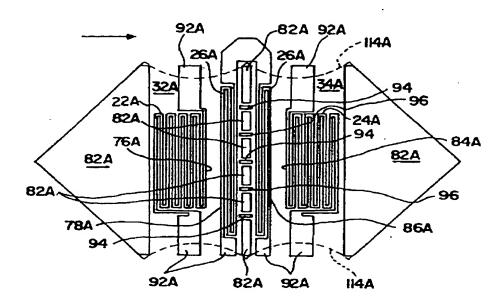
第9図



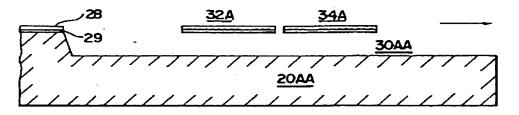
第11図



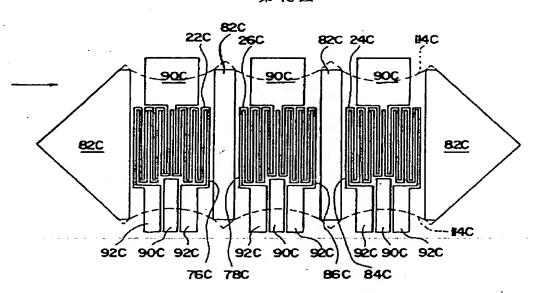
第 10 図



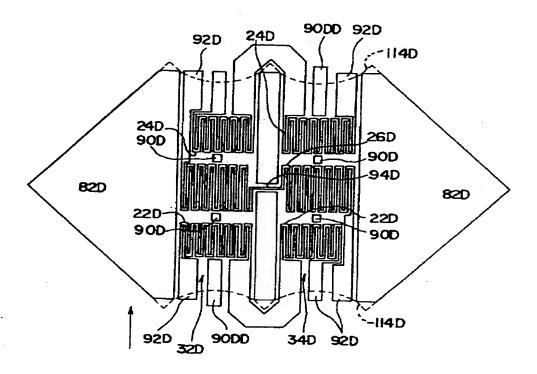
第12図



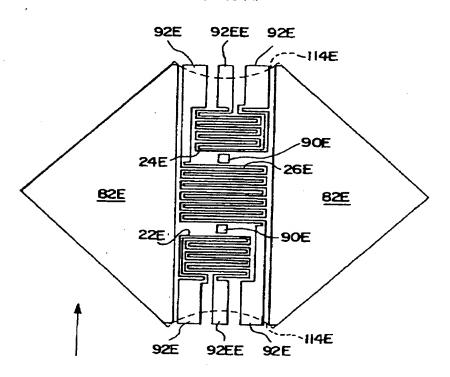
第13図



第14図



第 15 図



第16図

第17図

